## XRR 解析レポート

## プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1126

2θ(°):開始 = 0.500,終了 = 5.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム データ間隔:1点ごとにフィッティング

母集団: 50 個体数: 50

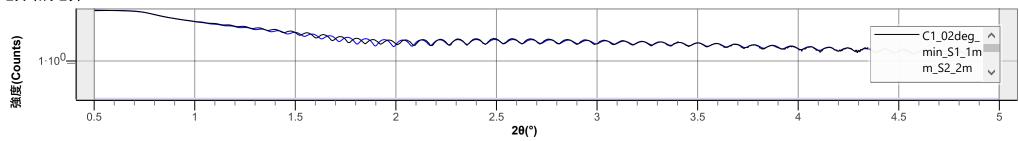
ターゲットχ²: 1.00e-004

重み: 50%

クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

## 結果 プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
<b>✓</b>	L5	Fe2O3	0.000 ±0.012 最小一	Const 精密化	4.94993	Const	0.125	Con
<b>✓</b>	L4	Fe2O3	2.519 ±0.019	Const 精密化	2.47500	Const	0.122	Con
	L3	** Fe	3.726 ±0.7	Const 精密化	7.87400	Const	0.000	Con
$\checkmark$	L2	* * ° Fe	85.162 ±0.03	Const 精密化	7.87400	Const	0.636	Con
<b>✓</b>	L1	Fe Fe	6.571 ±0.06	Const 精密化	6.67302	Const	1.287	Con
<u> </u>	基板	<b>⊡</b> Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con